

波長分散型蛍光X線分析装置

～蛍光X線分析法でよりよいデータを得るために～

蛍光X線分析(XRF)は、物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を検出し元素分析を行う分析手法で、簡便性、迅速性及び再現性において、ICP発光分析法や原子吸光分析法と比べ非常に優れており、非破壊分析の一種として幅広い用途に使われています。

今回導入した波長分散型蛍光X線分析装置について、基礎から応用までわかりやすく学ぶ内容を予定しています。



リガク ZSX Primus II

1日目:講義

11月26日(火)

14:00～17:00

内容(予定)

14:00 蛍光X線分析の基礎講座

16:00 試料調整法

2日目:実習

11月27日(水)

10:00～17:00

内容(予定)

10:00 測定実習①(講師準備試料)

13:00 測定実習②(参加者持込み試料)

場所:理系複合棟321室・318室

講師:(株)リガク X線機器事業部

SBU WDXグループ 閑歳浩平 氏

申込み

予約QRコード又は下記のサイトから予約

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=92

申込期限: 11/25 15:00まで(以降は当日会場にて受付)

※試料持込みを希望する場合は、事前予約・相談が必要です。

詳しくは下記問い合わせ先まで。

ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。



問い合わせ先

機器分析支援センター事務室(理系複合棟307室)

技術専門職員 儀間 真一、池原 清子

TEL: 895-8967 HP: <http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催:機器分析支援センター